

平成28年度補助金対象新設機器の紹介

広島市の中小企業が抱えている技術的な課題に対応する機器・検査用機器の整備を図るため、(公財) JKA からの補助をうけて下記の機器を導入しました。

ご利用方法など、各機器の詳細については当センターまでお気軽にお問い合わせください。

走査電子顕微鏡

細く絞った電子線を用いることで、試料表面の状態を観察することができる装置です。特に、凸凹のある試料を立体的に観察することが可能です。金属部品の破壊原因の究明（破面観察）やめっき層の厚さの確認などに活用できます。

[型式]

日本電子株式会社 JSM-7200F

[仕様]

- ・電子銃 : 電解放出形
- ・分解能 : 1.0nm (加速電圧 20kV)
1.6nm (加速電圧 1kV)
- ・倍率 : 10~1,000,000 倍
- ・試料室サイズ : 直径 150mm×高さ 40mm
- ・対物レンズ方式 : アウトレンズ形

